XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)| ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead データ間隔:1点ごとにフィッティング

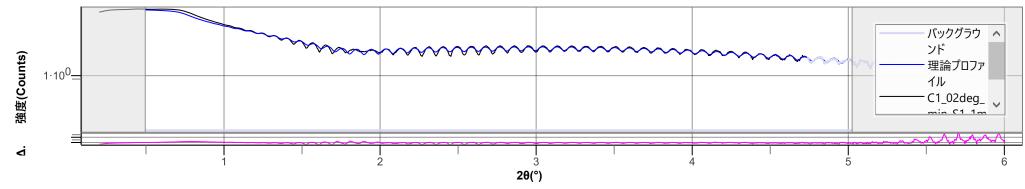
最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
✓	L5	Fe2O3	0.625	Const	4.9500		0.100	Con
			±0.017	精密化	±0.05	→最大 精密化	±0.03最小←	精密化
\checkmark	L4	Fe2O3	1.635	Const	2.5101	5 Const	0.100	Con
			±0.016	精密化	±0.03 最小←	精密化	±0.04最小←	精密化
✓	L3	Fe ·• Fe	3.726	Const	7.8740) Const	0.000	Con
			±0.7	精密化	±0.09	→最大 精密化	±0.02最小←	精密化
✓	L2	* ° Fe	87.850	Const	7.3578	5 Const	0.100	Con
			±0.02	精密化	±0.05	→最大 精密化	±0.04最小←	精密化
<u>~</u>	L1	Fe	2.680	Const	3.9370	1 Const	0.100	Con
			±0.13	精密化	±0.08 最小←	精密化	±0.03最 小 ←	精密化
\checkmark	基板	🖸 Si	∞		2.3292	4 Const	0.500	Con